

資源・環境関連材料部会 第10回セラミックス化学分析技術セミナー 開催報告

資源・環境関連材料部会では、平成27年12月3日（木）に、東京都立産業技術研究センター本部会議室に於いて、東京都立産業技術研究センターとの共同主催、日本分析化学会の協賛で標記セミナーを開催しました。

23名の参加者を迎え、渡村信治 部会長ならびに鈴木雅洋 東京都立産業技術研究センター理事のご挨拶の後、5件の講演がなされました。

講演では、認証標準物質候補試料の調製方法、O,N,C,Sなどのガス分析、X線回折法を用いた結晶構造解析、そしてポリキャピラリーを用いた微量部の蛍光X線分析について、測定の基本原則から最新の装置構成までを様々な測定事例を通して解説いただきました。また、分析値の妥当性の評価方法や数値の統計的な取り扱いについても、平易な表現で講演していただき参加者の理解が深まりました。

いずれの講演にも多くの熱心な質疑応答があり、参加者各位の関心の高さがうかがわれました。

今回は昨年のセラミックス関係分析技術者研究発表会と同じく東京都立産業技術研究センターで開催でしたが、多くの方々にご参加いただき、盛況のうちに閉会することができました。

ご参加くださいました皆さまに厚くお礼を申し上げます。

また、当セミナーの企画、運営に多大のお力添えをいただきました部会役員、東京都立産業技術研究センターおよび講師の先生方の各位に感謝申し上げます。

当部会の化学分析分科会は、現場で活躍するセラミックス関係の分析技術者が一堂に集う国内で唯一の組織です。

今後も定例の会合の他隔年に開催する研究発表会とセミナーを通じて、各種情報の交換、分析技術の研鑽や技術者の交流を図っていきます。引き続きまして、日本セラミックス協会会員の皆さまのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

(資源・環境関連材料部会化学分析分科会)



写真1 挨拶をされる渡村部会長



写真2 講演風景